

MICROSCOPIE À FORCE ATOMIQUE (AFM)

FABRICANT : NanoINK

MODÈLE : Nscriptor

Échantillons

- Taille d'échantillons : 50 mm maximum
- Épaisseur : 38 mm maximum

Analyses

- Type : mode contacte et mode AC (tapping mode)
- Applications : mesure de taille de particules sur une surface, d'épaisseur de dépôt et de la rugosité des surfaces

Caractéristiques

- Cartographie possible avec une précision de 150 nm
- Résolution latérale : 1 nm
- Plage scanner XYZ : 90 x 90 x 8 µm
- Équipement permettant de faire de la lithographie par nanomouillage (Dip-Pen)